PASJ2015 WEP128

コヒーレントチェレンコフ放射を用いたテラヘルツ透過イメージング

STUDY ON THZ IMAGING BY USING A COHERENT CHERENKOV RADIATION

西田万里子^{#, A)}, 水柿将貴^{A)}, 鷲尾方一^{A)}, 坂上和之^{B)}, 黒田隆之助^{C)}, 平義隆^{C)} Mariko Nishida ^{#, A)}, Masataka Mizugaki^{A)}, Masakazu Washio^{A)}, Kazuyuki Sakaue^{B)},

Ryunosuke Kuroda^{C)}, Yoshitaka Taira^{C)}

^{A)} Research Institute for Science and Engineering, Waseda University

^{B)} Waseda Institute for Advanced Study, Waseda University

^{C)} National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

Abstract

THz frequency is a special electromagnetic wave which is categorized between a radio wave and a light wave. It can pass through the various materials like a radio wave and can be transported with optical components like a light wave. Thus, it's suitable for imaging application of materials. Moreover, there exist some materials which have absorption spectra in the THz frequency range. Therefore, THz light is expected as an industrial tool to identify drugs and to detect explosives. At Waseda University, it's possible to generate a high-quality electron beam using Cs-Te photocathode RF-Gun and the electron beam is applied to several application researches. As an application of this electron beam, we generate a coherent Cherenkov radiation, and succeed in observing a high power THz light. As this THz light can be obtained as an extremely wideband THz pulse, we can not only apply it to imaging but also observe the difference in transmittance of THz frequency. As THz imaging, we attempt scan imaging and direct imaging with THz camera. In this conference, we report the outline of generating a THz Cherenkov radiation, results of the THz imaging of materials and future prospects.

1. はじめに

近年の急速な技術革新によりテラヘルツ光を用い た応用研究が進められており、その応用分野は工 業・医療・バイオ・農業・セキュリティーなど多岐 にわたる[1]。テラヘルツ光は電波と光波の両方の性 質を兼ね備えている特殊な電磁波である。そのため, 電波のように紙・プラスチック・セラミック・木 材・脂肪など様々な物質を透過するとともに、光波 のようにレンズやミラーといった光学素子によって 自由に輸送することができ、新たなイメージング ツールとして期待されている^[2]。イメージングツー ルとしては、レントゲン検査や空港の手荷物検査な どで用いられている X線がよく知られている。対象 物の透過強度分布を測定し、非破壊で透視画像を取 得するという点では X 線もテラヘルツ光も同じであ るが,新たにテラヘルツ光を用いるメリットとして, 主にその安全性が挙げられる。テラヘルツ光の周波 数は 0.1THz~10THz 程度であるため, X 線に比べて 極めてエネルギーが低い。そのため、人体への害が 非常に少ないことから人体に照射し, 隠し持ってい る刃物や拳銃などの凶器を検知することが可能とな る。さらに、透過イメージングだけでなく、光波の 性質を利用した反射イメージングで透視画像を取得 することもできる。これにより, 壁紙で見えない部 分のコンクリートのひび割れや塗装で見えない部分 の車体の錆などを検知することが可能である。

我々は早稲田大学が所有する Cs-Te フォトカソー

ド RF-gun を用いて電子ビームからコヒーレントな チェレンコフ放射光を生成し,高強度のテラヘルツ 光を観測することに成功した。本発表では,このテ ラヘルツ光を用いた物質の透過イメージングおよび 反射イメージングの試験結果について報告する。

2. テラヘルツ光生成

2.1 コヒーレントチェレンコフ放射

チェレンコフ放射は、荷電粒子が誘電体を通り過ぎる際、電場によって誘電体が分極をおこし、その 荷電粒子が通り過ぎた後、誘電体の分極が元に戻る ときに電磁波を放射するという仕組みである。放射 条件は、電子の速度 v が屈折率 n の誘電体物質中を 進む光の速度 c/n よりも速いとき、すなわち、

$$\beta n > 1 \tag{1}$$

と表される。また、このときの放射角度は、

$$\cos\theta = \frac{1}{n\beta} \tag{2}$$

と定義される[3]。

さらに、放射光のコヒーレンスの程度は電子ビー ムのバンチ長のみならず、エミッタンスやビームサ イズにも依存するが、総じてコヒーレントな放射で ある場合、全放射強度 P は 1 電子あたりの放射強度 P₀に対して電子ビームに含まれる電子の数 N の二乗 に比例することが知られている^[4]。

[#] m-nishida.mari@ruri.waseda.jp

2.2 早稲田大学における実験装置



Figure 1: Schematic of electron beam line layout.

本実験では、テラヘルツ光に対してほぼ透明な誘 電体である TOPAS^[5]をターゲットとし,電子ビーム を通過させることでチェレンコフ放射を発生させる。 図1に本研究でのビームラインの概要図を示す。 我々の加速器システムは全長約 3m と非常にコンパ クトである。RF-gun の直下にあるソレノイド電磁石 で電子ビームのエミッタンスを補正し、その後、2 つの四重極電磁石によって収束, ステアリング電磁 石によって位置の補正を行ない、ターゲットに照射 している。RF-Deflector で電子ビームを傾けること で、傾けない状態よりも放射方向から見た電子の進 行方向の長さにあたる距離を短くすることができ, よりコヒーレントなテラヘルツ光が得られることが 期待できる⁶⁰。ターゲットとして用いている TOPAS はテラヘルツ帯で屈折率がほとんど変化しないとい う性質があり、その値は約 1.52 である^[7]。したがっ て,式(2)よりテラヘルツ帯におけるチェレンコフ放 射角はおよそ 48.9°とわかる。ターゲットの形状を 三角形にし、一つの角を 48.9°とすることで観測角 もチェレンコフ放射角と同じくおよそ 48.9°となる。 テラヘルツ光の観測には広帯域の準光学的検波器 (QOD: Quasi-Optical schottky Diode detector)^[8]を用いた。

2.3 テラヘルツ光の観測

QOD で観測されたテラヘルツ光がチェレンコフ放 射光によるものであるのか,かつコヒーレントであ るのか,ということを確かめた。

本実験における, TOPAS からの放射の原理を図 2 に示す。ここでのチェレンコフ放射は, 理論的には 電子ビームの軌道に対しておよそ 48.9°の角度で円 環状に放出されることがわかっている。また, 観測 用の真空管は電子ビームの進行方向に対して 45°の 角度でついている。したがって, TOPAS から放出さ れたチェレンコフ放射の一部分を大気中に取り出し,



Figure 2: Diagram of radiation from electron beam and TOPAS.

QODによって観測しているということになる。まず, 偏光の計測を行い,ほぼ直線偏光であることを確認 している。これはチェレンコフ放射の一部を取り出 していることを示しており,遷移放射などではなく, 確実にチェレンコフ放射であることを確認した。

前節で述べたように、コヒーレントな放射光であ る場合、放射強度は電子数の二乗に比例する。QOD の手前にバンドパスフィルターを設置し、特定の波 長における電子ビームの電荷量と放射強度の関係を グラフに表したものが図 3 である。本実験では、 0.5THz と 1.5THz のバンドパスフィルターを用いた。 測定結果のプロットは二乗でフィッティングするこ とができ、これより、放射強度は電子ビームの電荷 量の二乗に比例していることがわかる。したがって、 コヒーレント放射光であるといってよい。

以上のことから,コヒーレントチェレンコフ放射 によるテラヘルツ光を観測していることが確かめら れた。



Figure 3: The relation between the intensity of (a) 0.5THz, (b) 1.5THz and the beam current.

3. テラヘルツイメージング

3.1 透過イメージング

コヒーレントチェレンコフ放射から得られたテラ ヘルツ光を用いて、まずは物質の透過イメージング 画像の取得を試みた。透過イメージングは対象とな る sample にテラヘルツ光を照射し、透過してきた光 の強度を QOD で測定する。テラヘルツ光は金属や 水分を含む部分は透過せず、プラスチックや紙部分 は透過するということを利用し、sample を 2 次元で 走査することで透過光の強度のコントラストを画像 化するという仕組みである。本実験におけるセット アップを図 4 に示す。まずは大気中に取り出したテ ラヘルツ光を sample に広範囲に照射する。QOD は sample にほぼ密着し、かつ Φ0.8mm の穴を開けたア



Figure 4: Schematic setup of transmission imaging. ルミニウム箔を貼り, QODにはこの穴を通った光し

PASJ2015 WEP128

か観測できないようにしてある。これにより,強度 を測定する範囲を小さくすることができ,最終的に は分解能の高いイメージング画像を取得することが できる。なお,測定時は sample を 1mm 間隔で動か した。

sample として pasmo を用い,実際に透過イメージ ング画像を取得した結果を図 5 に示す。外形に関し て比較すると,取得画像の大きさは実物よりも 1mm 大きい程度であり,ほぼ実物と相違なく画像として 見えているといってよい。pasmo の表面はプラス チックであるためテラヘルツ光が透過することから, 普段目には見えていない,内部の IC チップやその周 辺の回路などの構造が確認できた。実際の内部構造 を把握するため,産業技術総合研究所にて pasmo の X 線透視画像の撮影を行なった。比較するとやや分 解能は劣るものの, IC チップやその他の部品,周り を囲む回路などの位置や大きさが X 線の画像と相違 なく見えていることも確認できた。



Figure 5: THz transmission image of pasmo.

3.2 反射イメージング

透過において実物と相違ないイメージング画像が 取得できたので,さらに物質の反射イメージング画 像の取得を試みた。反射イメージングは透過イメー ジングとは異なり,対象となる sample にテラヘルツ 光を照射し,反射してきた光の強度を QOD で測定 する。テラヘルツ光は金属で反射するということを 利用し, sample を 2 次元で動かすことで反射光の強 度のコントラストを画像化するという仕組みであ る。もし金属の表面に凹凸があれば,テラヘルツ光 は異なった方向に反射または散乱するため,平面の 部分と凹凸がある部分では測定される強度の違いが 生じる。したがって,その凹凸をイメージング画像 として再現できるはずである。本実験におけるセッ



Figure 6: Schematic setup of reflection imaging.

トアップを図 6 に示す。大気中に広がって出てきた テラヘルツ光をレンズによって平行に,さらに集光 させ,集光点付近に sample を設置する。反射光は再 びレンズによって集光され、QOD に入るように光路 を組んだ。sample となる金属の平面の部分に光が当 たっているときに最終的に光が QOD まで輸送され るよう,あらかじめレーザーを用いてアライメント をとり, sample の位置も調整した。また,今回は QOD の手前に 0.5THz のバンドパスフィルター(BPF) を設置し,0.5THz の光でイメージング画像の取得を 試みた。なお,測定時は sample を 0.5mm 間隔で動か した。

sample として 10 円玉を用い, この 10 円玉の表面 の凹凸をイメージング画像として取得することを目 標に、測定を行なった。実際に反射イメージング画 像を取得した結果を図7に示す。取得画像から、10 円玉の表面の『10』の文字が浮かび上がって見える ことが確認できた。実際の 10 円玉の大きさは Φ23.5mm であるのに対し、取得画像の大きさは縦 23.5mm×横 22.5mm であった。縦方向は実物と同じ 大きさであったのに対し、横方向は実物よりも小さ いということについて, sample を置いた角度と走査 する方向が完全に一致していないことに起因してい ると考えている。また、浮かび上がった文字の大き さに関しては、実物よりも 0.2~0.3mm 大きい程度 であり,ほぼ実物と相違なく画像として見えている ことも確認できた。今回, 1.0THz や 1.5THz のバン ドパスフィルターを使って同様の測定を試みたが, 反射光の強度のコントラストを測定するのに十分な 強度が得られなかったために画像を取得することは できなかった。1.0THz や 1.5THz でも十分な強度が 得られれば、周波数による取得画像の分解能の違い やコントラストの違いを見ることができると思われ Z^[9]



Figure 7: THz reflection imaging of 10 yen.

4. まとめと今後の展望

加速させた電子ビームから得られたコヒーレント なチェレンコフ放射光を生成し,取り出したテラへ ルツ光を用いて物質の透過イメージング画像,さら には反射イメージング画像を取得することに成功し た。両者は共に,実物とほぼ相違ない,分解能も比 較的高い画像が得られた。

今後は、より強度の高いテラヘルツ光の生成を目 指し、反射イメージングにおいて周波数ごとの取得 画像の分解能やコントラストの違いを確認する。さ らには、壁紙で覆われた部分のコンクリートのひび 割れの検査、塗装で隠れた部分の金属の錆の検知な

PASJ2015 WEP128

どの産業応用に向けた実験や、3次元画像取得に向 けた断面画像測定による物理的な内部構造の把握に 取り組んでいく予定である。

参考文献

- [1] www1.mlit.go.jp/road/tech/jigo/h22/pdf/report22-4.pdf
- [2] 工業調査会、西澤潤一、テラヘルツ波の基礎と応用、 2005.
- [3] A.P.Potylitsyn, et al., Proc of IPAC'10, MOPE046 (2010).
- [4] T.Takahashi, et al., Phys. Rev. E 62, 8606 (2000).
- [5] http://www.polyplastics.com/jp/product/lines/topas/[6] K.Sakaue et al., Proc. of this conference WEP097.
- [7] Paul D. Cunningham, et al., J.Appl.Phys. 109, 043505 (2011).
 [8] http://www.vadiodes.com/index.php/en/
- [9] pioneer.jp/en/crdl design/crdl/rd/pdf/2014-1.pdf